# ・光学设计・

# 基于FPD的轻小型数字X光成像系统

张 旭,孙秀斌

(北京市公安局警卫局,北京 100006)

摘 要:针对反恐排爆领域中对静止遗留物(如行李箱)内部的透视成像,阐述了一种基于FPD的轻小型数字X光成像系统。该系统采用平板探测器和点状锥形光源相结合的硬件设计方式,减小了系统的体积和质量,直接数字化输出,提高了产品集成度;通过图像非均匀性校正和降噪滤波增强算法设计,提高了图像的清晰度和可视化效果。经过测试和实验,系统工作稳定、性能良好,可广泛应用于反恐排爆领域。

关键词:FPD(平板探测器));X光;成像系统

中图分类号:TN144;TN29;TN453 文献标识码:A

文章编号:1673-1255(2016)0-04-0006-05

# Light Small Digital X-ray Optical Imaging System Based on FPD

ZHANG Xu, SUN Xiu-bin

(Guard Bureau of Beijing Municipal Public Security Bureau, Beijing 100006, China)

**Abstract:** A light small digital X-ray optical imaging system based on the FPD (flat panel detector) is expounded for EOD (explosive ordnance disposal) field of static remnants (such as inside the suitcase) perspective imaging. The hardware of flat panel detector and point cone light source is designed in combination type to reduce the volume and weight of the system. Also, the images are output in direct digital way and the product integration is improved apparently. Through the image de-noising and filtering enhancement algorithm design, the clarity of the image and visual effect are improved. In the test and experiments, the system shows stable work and good performance. It can be widely used in the field of EOD field.

Key words: FPD (flat panel detector); X-ray; imaging system

20世纪末,平板探测器(flat panel detector, FPD) 的研制成功,诞生了一种新的放射影像成像技术—— 数字X线摄影(digital radiography, DR)<sup>[1-2]</sup>。目前 DR 技术日趋成熟,已广泛应用于医疗透视、工业无损检 测、汽车应用等领域<sup>[3-5]</sup>。近年来,随着国际恐怖主义 势力抬头,防爆安检形势日趋严峻,特别是在敏感地 点对行李箱等封闭或半封闭空间遗留物检测<sup>[6-7]</sup>。传 统的安检方法是将行李箱等物品放在安检机皮带上 进行移动式扫描检测。该方法虽然简单易行、技术成 熟,但需要移动物体,极易触发爆炸物引信,给公共安 全造成严重危害<sup>[89]</sup>。因此,目前亟待解决对遗留物的 静态透视成像检测问题,实现对遗留物的现场实时便 携式检测。

针对上述问题,提出一种基于FPD的轻小型数 字X光成像系统。该系统基于平板探测器成像模 式,可解决物体的静态透视成像问题,且设备体积 小、质量轻,满足便携式携带要求,实现非接触式物 体的透视成像检测。该系统原型机目前已在防爆 安检等领域进行了多次现场实时检测,成像清晰, 性能稳定可靠。

收稿日期:2016-08-01

基金项目:公安智能监控开放基金(J101230K3047)

作者简介:张旭(1980-),男,本科,助理工程师,北京人,主要从事防爆安检方面的研究.

# 1 系统设计

## 1.1 系统架构

基于 FPD 的轻小型数字 X 光成像系统主要由 平板探测器单元、X 光发射单元和终端控制单元组 成,系统组成如图1所示。



X 光发射单元为主动照射光源,发出锥形 X 光 对物体进行透视。在 X 光照射下, X 射线平板探测 器的闪烁体或荧光体层将 X 射线光子转换为可见 光, 而后由具有光电二极管作用的非晶硅阵列变为 图像电信号, 通过外围电路检出及 A/D变换, 从而获 得数字化图像。终端控制单元接收探测器单元的 数字图像信号, 对该图像进行处理和检测, 并对发 射单元射线剂量大小进行数控调节。

### 1.2 硬件设计

系统硬件设计包括平板探测器单元和 X 光发 射单元的设计。

### 1.2.1 平板探测器单元

平板探测器由感光阵列(碘化铯闪烁体层和非 晶硅光电二极管阵列)、行驱动电路、图像信号读取 电路和时序信号发生器构成<sup>101</sup>,其物理结构和逻辑 结构如图2所示。位于探测器顶层的碘化铯闪烁晶 体将入射的X射线透视图像转换为可见光图像。 位于闪烁层下的硅光电二极管阵列将可见光图像 转换为电荷图像,每个像素电荷量的变化与入射X 射线的剂量成正比;同时该阵列将空间上连续的X 射线透视图像转换为一定数量的行和列构成的点 阵式图像,其中点阵的密度决定了图像的空间分辨 率。在时序信号发生器的统一控制下,居于行方向 的行驱动电路与居于列方向的读取电路将电荷信 号逐行取出,转换为串行脉冲序列并量化为数字信 号;获取的数字信号经通信接口电路传送至图像处 理器,从而形成X射线数字图像。



图2 平板探测器结构示意图

设计的平板探测器主要性能参数如表1所示。

表1 平板探测器性能参数

像素大小	400 µm	面阵分辨率	1 024×1 024
平板有效区大小 409.6 mm×409.6 mm		帧频	5
数据位宽	16 bit	闪烁晶体	CsI
供电电压	12 V,10 W	质量	3 kg

#### 1.2.2 X光发射单元

X射线发射单元由X射线管、高频高压发生器 和控制器组成<sup>111</sup>,如图3所示。

X射线管是产生X射线的线源设备,由真空玻 璃内的阳极和阴极组成。对阴极端的钨制灯丝通 以低电压,灯丝被加热发射自由电子,当X管两端 被加高压后,自由电子被加速并轰击钨靶产生X射 线,经发射窗输出后形成锥形光束。

高频高压发生器对主电压进行整流、滤波后反 馈至逆变器,直流电压经过逆变器变成高频交流电 压,再进入高压变压器后通过进一步整流和滤波形 成连续高压,如图4所示。



图4 高频高压发生器信号转换原理图

控制器对高频高压发生器的电压和电流进行 取样,通过闭环负反馈实时控制X射线管的功率 输出。设计的X光发射单元主要性能参数如表2 所示。

管电压	15~30 kV	束散角	60°×60°	
管电流	0.1~0.4 mA	电源输入	AC220 V/50 Hz	
焦点尺寸	0.8 mm	工作方式	连续工作	
供电电压	12 V,10 W	冷却方式	密封油冷	

表2 X光发射单元性能参数

## 1.3 软件设计

系统软件设计包括终端控制单元设计,具体包 括探测器图像非均匀性校正算法设计和图像降噪 增强算法设计。

### 1.3.1 图像非均匀性校正算法

系统采用的平板探测器为间接型成像探测器,

影响其成像均匀性的主要有三个因素。首先,在线 性曝光剂量范围内,探测器单个像元的X射线间接 响应近似为线性的,但不同像元的X射线响应系数 并不完全一致,从而导致图像不均匀;其次,行驱动 电路,读取放大器、A/D转换器等外围电路的不一致 导致图像不均匀;最后,入射X射线本身固有的空 间分布不均匀性导致图像不均匀。这几类非均匀 性尽管在图像上的表现不同,但都属系统性的不均 匀,在一定的限度内可以通过软件处理来加以校 正。其中读出电路自身非均匀性对整个图像的影 响较小,可暂不考虑;像元间的非均匀性如坏点等 在出厂前厂家已进行坏点校正,因此重点考虑X射 线本身固有的空间分布不均匀性导致的图像非均 匀性。

X射线为点状光源,呈60°光锥能量分布,因此 会造成能量中间强,周边弱,在图像上出现亮暗分 布不均匀。对平板探测器横向像元线阵进行测试, 如图5所示。从中可以看出,线阵越靠近焦点中心 位置能量越大。



平板内各探测单元的响应度近似为线性关系, 可采用单点校正方法来校正其相应的非均匀性。 单点校正是在同一X光照射条件下,将各像元输出 的信号{y(φ)}校正为一致。按照线性关系进行校正 时,校正方程可表述为

 $y'_{i}(\varphi) = G_{i}y_{i}(\varphi)$  *i*=0,1,…,*n*-1 (1) 其中, $y_{i}(\varphi)$  和  $y'_{i}(\varphi)$  分别是校正前、后第*i*个像元中 的输出信号; $G_{i}$ 为第*i*个像元的校正系数。非均匀 性校正过程分为标定和校正两步。首先测出在 X 光照射下各像元的输出响应{ $y_{i}(\varphi)$ },从而得出校正 系数为

$$G_i = \frac{\overline{y_i(\varphi)}}{y_i(\varphi)}$$
(2)

其中, y<sub>i</sub>(φ) 为各单元原始响应信号的平均值。将校 正系数{G}存入相应的存储单元,从而完成了非均 匀性标定;其次,将实际像元的响应信号与各自的 校正系数相乘,即完成非均匀性校正。校正前后的 图像如图6所示。实验表明,单点校正算法可达到 较好的校正效果。



图6 非均匀性校正前后图像

#### 1.3.2 图像降噪增强算法

系统应用于排爆领域,属于静止成像,针对X 光平面探测器成像特性,其噪声主要集中于随机噪 声。一般随机噪声服从泊松分布,由于光子数较 多,成像过程中,光子的起伏较小。系统采用多帧 平均法,根据噪声空域随机性分布特点,可有效压 缩随机噪声,增强目标信息。

若噪声是平均值为0的随机分布信号,图像表 达为

$$f(x,y) = S(x,y) + N(x,y)$$
(3)

其中,S(x,y)是无噪声图像;N(x,y)是图像的噪声;f(x,y)为叠加了噪声的图像。如果有n帧图像 平均,则可以有下式

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f_i(x,y)$$
(4)

逼近无噪声原图像S(x,y)

$$E\{\hat{f}(x,y)\} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E\{f_i(x,y)\}$$
(5)

即 
$$E\{f(x,y)\} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} S_i(x,y)$$
 (6)

即 
$$E\{\hat{f}(x,y)\} = S(x,y)$$
 (7)  
估计误差为

$$\sigma_f^2 = E\{ [\hat{f}(x,y) - S(x,y)]^2 \}$$
(8)

$$\mathbb{E}[0] \qquad \sigma_f^2 = E\{\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f_i(x,y) - S(x,y)\right]^2\}$$
(9)

$$\mathbb{H} \qquad \sigma_f^2 = E\{\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n N_i(x,y)\right]^2\}$$
(10)

由于噪声*N<sub>i</sub>(x,y)*时域分布特性是不相关的、随 机的,且服从泊松分布,因此噪声之间的相关系数 *C<sub>i</sub>*=0,即

$$E[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}N_{i}(x,y)]^{2} = \frac{1}{n}\sigma_{N}^{2}$$
(11)

$$\mathbb{H} \qquad \sigma_f^2 = \frac{1}{n} \sigma_N^2 \tag{12}$$

由此可得,当几帧静止图像累加平均后,目标 的无噪声原图像作重复性累加,而随机噪声则作二 次项累加。N帧图像累加后,信号S(x,y)放大了N 倍,而噪声N(x,y)放大了√N倍,信噪比提高了√N 倍。图7是采用帧平均算法降噪前后的效果对比。



图7 多帧去噪前后效果

# 2 系统测试

系统经设计、加工、集成后,对真实目标进行测 试和实验验证。产品测试环境如下:对一330 mm× 160 mm×100 mm的纸盒内部进行检测,检测面为 330 mm×160 mm,系统辐射角为60°×60°,光源距成 像面300 mm,纸盒紧贴平板探测器,以节省辐射剂 量。系统实际工作效果如图8所示。



图8 系统实际效果图

实验表明,系统设计正确、工作稳定,可应用于 实际的防爆安检领域。

# 3 结 论

阐述了基于FPD的轻小型数字X光成像系统, 结合静态成像的实际需要,采用平板探测器作为成 像器,可提高系统的集成度,大大减小体积和质量; 采用锥形点光源可有效增大辐射面积,最大程度节 约辐射剂量,利于系统的小型化。通过图像非均匀 性校正算法和降噪增强算法,提高了图像的清晰 度。系统设计后的体积为600 mm×600 mm×440 mm (含包装箱),质量10 kg,可实现便携式管理,可广泛 应用于反恐防爆安检领域中对未知目标的防爆清 晰检测。

#### 参考文献

- [1] 孝大宇,蔡鹏飞,李宏,等.基于阈值的平板探测器增益 校正方法[J].东北大学学报(自然科学版), 2014, 35(2): 208-211.
- [2] 肖永顺,陈志强,张丽,等.基于数字平板探测器的高能

X射线成像实验研究[J]. 光学技术, 2003, 29(6): 660-661.

- [3] 王远,许州,陈浩. 基于平板探测器的高能工业CT数据 采集系统[J]. CT理论与应用研究, 2006,15(3):53-56.
- [4] 陈光,丁克勤,梁丽红. 便携式 DR 与 CR 成像技术在焊 缝检测中的应用[J]. 无损检测, 2009, 31(6):494-495.
- [5] 郭栋,王明泉. 基于 PaxScan 的实时成像系统开发与应用[J]. 电子技术应用, 2010(4):135-136.
- [6] 谢明刚. 浅析防爆安检装备在警卫工作中的应用[J]. 武 警学院学报,2015, 31(3):22-24.
- [7] 李福会,高瑞峰.首都防爆安检装备发展现状[J].警察 技术,2007(4):47-50.
- [8] 冀晓宏. 民用机场安全检查设施现状与分析[J]. 中国民 用航空,2008, 94(10):60-66.
- [9] 孙丽娜,原培新.X射线安检设备智能控制与诊断系统 设计[J].仪器仪表学报,2007,28(1):154-157.
- [10] 苗青,王高,李仰军.X射线成像探测器发展进展[J].传感器世界,2015,21(10):7-9.
- [11] 杨磊,李东仓,祁中.数控高稳定X射线源的研制[J].核 技术,2008,31(5):388-391.

# 《光电技术应用》期刊简介

《光电技术应用》期刊是中国电子科技集团公司主管,中国电子科技集团公司光电研究院主办,公开发行的学术性中文科技期刊。以光电技术为主要专业特色,传播光电技术、光电系统应用技术专业领域的先进科技信息,报道新型科技成果,推动工程技术交流,促进行业科技进步与发展。

期刊已成为《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊、《中文科技期刊数据库》收录期刊、《中 国期刊全文数据库》全文收录期刊、《中国学术期刊综合评价数据库》统计源期刊、美国《乌利希 期刊指南》收录期刊。期刊的影响因子连续几年上升,2015年入选《中国学术期刊影响因子年 报》统计源期刊。

因主办单位搬迁,从即日起期刊编辑部通信地址变更为天津市空港经济区纬五道9号,邮 编为300308。电话:022-59067938。投稿邮箱:aoe-cetc@vip.163.com。原邮箱nloe@vip.163.com 继续使用至2016年12月31日。竭诚欢迎广大读者踊跃投稿。